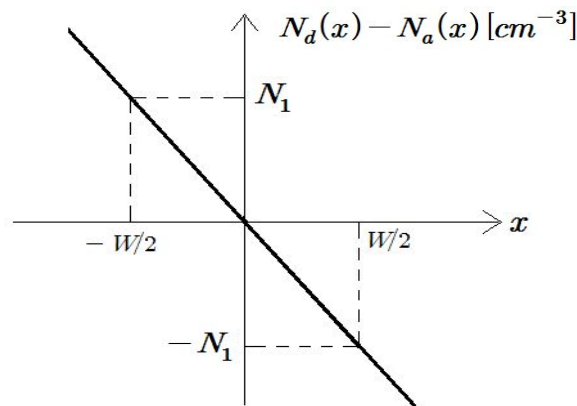


2016년도 제53회 변리사 2차 국가자격시험 문제지

교시	시험과목	시험시간	수험번호	성명	향후일정 안내
2교시	반도체공학	120분			

【 문제-1 】 (30점)

확산공정에 의해 실리콘 pn 다이오드를 제조한 결과, 도너농도 N_d 와 억셉터 농도 N_a 의 분포가 그림과 같다. W 는 열평형상태에서의 공핍층 폭이다. 볼츠만 상수는 k_B , 절대온도는 T , 전자의 전하량 크기는 e , 실리콘의 유전율은 ϵ , 진성 캐리어 농도는 n_i 이고, 도펀트의 완전 이온화를 가정한다. 문제에서 주어진 파라미터를 이용하여 다음의 물음에 답하시오.



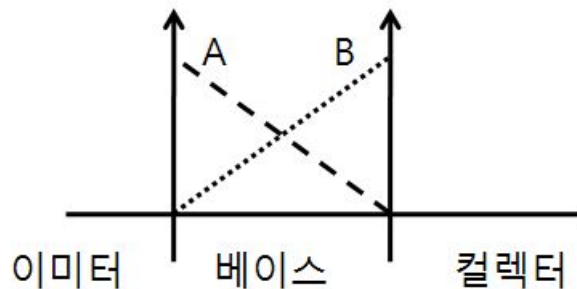
- (1) 열평형상태일 때 공핍층에서 체적전하밀도 $\rho_v(x) [C/cm^3]$, 전기장 $E(x) [volt/cm]$, 전위 $V(x) [volt]$ 의 식을 구하고, 최대 전기장의 크기를 구하시오. ($x = -W/2$ 에서 $V(x) = 0 = E(x)$ 을 가정한다.) (8점)
- (2) (1)에서 구한 $V(x)$ 식으로부터 내부전위 V_{bi} 를 구하고(e, ϵ, N_1, W 로 표현), 또한 내부전위 V_{bi} 를 $x = -W/2$ 와 $x = W/2$ 에서의 페르미 에너지 차이로부터 구하시오(e, k_B, T, n_i, N_1 로 표현). (6점)
- (3) 역방향 전압 V_R 을 인가한 경우 공핍층의 폭을 W_R 이라고 할 때, $W_R/2$ 값과 $V_{bi} + V_R$ 값 간의 관계를 수식으로 나타내고, 이로부터 커패시턴스 $C = \left| \frac{dQ}{dV_R} \right| [F/cm^2]$ 와 $V_{bi} + V_R$ 값 간의 관계식을 구하시오. ($V_{bi} + V_R \propto \left(\frac{W_R}{2} \right)^3$ 이용) (10점)
- (4) 역방향 전압 V_R 에 따라 커패시턴스 $C [F/cm^2]$ 를 측정하여, 위 농도 그래프에서 직선 기울기와 내부전위 V_{bi} 를 측정하는 방법을 설명하시오. (6점)

반도체공학 3-1 [2교시]

【 문제-2 】 (20점)

- (1) npn 형 동종접합 바이폴라 트랜지스터에 비해 이종접합 바이폴라 트랜지스터가 가질 수 있는 장점과 그 이유를 이미터-베이스간의 접합 장벽 및 접합 커패시터의 관점에서 각각 설명하시오. (10점)
- (2) 실리콘(Si)의 밴드갭이 1.12 eV인데 비해 게르마늄(Ge)의 밴드갭은 그보다 작은 0.66 eV 이다. 따라서 SiGe에서 게르마늄의 비율이 높을수록 밴드갭이 감소한다. pn 바이폴라 트랜지스터에서 베이스의 게르마늄 조성이 A 또는 B와 같이 되어 있는 경우, 베이스 전송 효율을 높게 하는데 유리한 쪽을 선택하고 그 이유를 설명하시오. (5점)

SiGe 중 게르마늄 조성 비

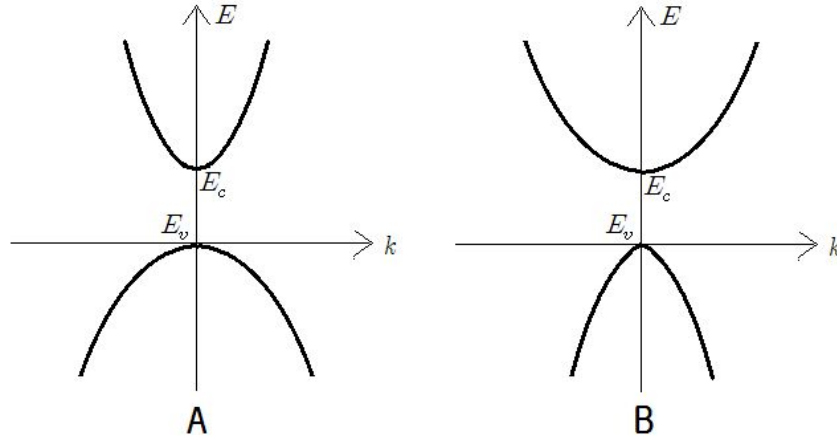


- (3) 바이폴라 트랜지스터의 컬렉터 전류가 증가하면 전류 이득 $\beta(= \frac{I_c}{I_b})$ 가 감소하는 원인을 2가지 설명하시오. (5점)

【 문제-3 】 (30점)

- (1) 길이 L_x, L_y 를 갖는 2차원 공간 내에서 전자의 에너지 상태 밀도함수는 $D(E) = \frac{m}{\pi \hbar^2} [eV^{-1}cm^{-2}]$ 이다. 전자가 에너지 상태를 점유할 확률이 근사적으로 $f(E) = e^{-(E-E_F)/k_B T}$ 라고 할 때, 전도대역의 전자농도 $n[cm^{-2}]$ 을 구하시오. (단, 전도대역의 최소 에너지는 E_c 이고, E_F 는 페르미 에너지, k_B 는 볼츠만 상수, T 는 절대온도이다.) (5점)

- (2) 두 반도체 물질 A와 B의 $E-k$ 다이어그램이 아래 그림과 같다. 다음의 물음에 답하시오. (10점)
- 1) 온도와 $E_c - E_F$ 가 같을 때, 물질 A와 B 중에서 전자의 농도 n 이 더 큰 것을 고르고 그 이유를 설명하시오.
 - 2) 진성반도체일 때, 물질 A와 B 중에서 페르미 에너지가 전도대역에 더 가까운 것을 고르고 그 이유를 설명하시오.



- (3) 드레인 포화전류 $I_{ds,sat}$ 이 큰 증가형 MOSFET($n^+poly-SiO_2-p$ 기판 형태)을 제작하려고 할 때, (2)의 $E-k$ 특성을 갖는 두 반도체 물질 A와 B 중에서 어느 것을 사용해야 하는지 결정하고 그 이유를 설명하시오. (5점)
- (4) (2)의 $E-k$ 특성을 갖는 두 반도체 물질 A와 B 중 하나 만을 사용하여 pnp 바이폴라 트랜지스터를 제작하려고 할 때, 높은 이미터 주입 효율 (특성 1)과 빠른 베이스 전송속도(특성 2)를 갖도록 하려면 물질 A와 B 중 어느 것을 사용해야 하는지 (특성 1)과 (특성 2)의 관점에서 각각 결정하고 그 이유를 설명하시오. (단, 전자와 정공의 확산길이는 동일하다.) (10점)

【 문제-4 】 (20점)

- (1) 0과 1의 데이터를 저장하는 Flash memory 셀의 단면 구조를 그리고, 디지털 데이터 0과 1을 각각 저장하는 방법과 그 원리를 각 단자의 전압 인가 상태와 함께 설명하시오. (10점)
- (2) Flash memory의 데이터가 전원이 없어도 보존되는 이유를 설명하고, 저장된 데이터를 읽을 때 0과 1을 구별하는 방법을 설명하시오. (MOS 트랜지스터의 전달 특성 그림을 이용) (10점)